ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Պարսամյ<mark>ան Հե</mark>նրիկ Աշոտի

ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼՈՒՄՆ ՈՒ ԿԼԱՆՈՒՄԸ ԳԼԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՄԲ ՄԻԿՐՈ և ՆԱՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Ա. 04.03 – «Ռադիոֆիզիկա» մասնագիտությամբ Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի Գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ – 2021

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Парсамян Генрих Ашотович

МОДУЛЯЦИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МИКРО И НАНОМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИММЕТРИЕЙ

ΑΒΤΟΡΕΦΕΡΑΤ

Диссертации на соискание ученой степени кандидата Физико-математических наук по специальности 01.04.03 – "Радиофизика"

EPEBAH - 2021

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում։

Գիտական ղեկավար՝	ֆմ.գ.դ., պրոֆեսոր Խ.Վ. Ներկարարյան
Պաշտոնական ընդդիմախոստեր՝	ֆմ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Ժ. Մուրադյան ֆմ.գ.դ. Ժ. Ս. Գևորգյան
Առաջատար կազմակերպություն՝	ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետ

Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ

Պաշտպանությունը կայանալու է 2021թ մայիսի 29-ին ժամը 12։00-ին Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ–ի 049 ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի նիստում։ Հասցե՝ 0025, Ա. Մանուկյան 1։

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ԵՊՀ գրադարանում։ Սեղմագիրն առաքված է 2021 թ. ապրիլի 15-ին։

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար

ֆ.-մ.գ.թ., դոցենտ Վ. Պ. Քալանթարյան

Тема диссертации утверждена в Ереванском государственном университете.

Научный руководитель:

д.ф.-м.н., прифессор **Х. В. Неркарарян**

Официальные оппоненты:

д.ф.-м.н., прифессор А. Ж. Мурадян д.ф.-м.н. Ж. С. Геворгян

Ведущая организация:

Институт физических исследований НАН РА

Защита диссертации состоится 29 мая 2021г. в 12:00 часов, на заседании специализированного совета 049 по физике при Ереванском государственном университете по адресу: 0025, ул. А. Манукяна 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ЕГУ. Автореферат разослан 15 апреля 2021г.

Ученый секретарь специализированного совета:

Hure

к.ф.-м.н., доцент В.П. Калантарян

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

<u>Աշխատանքի արդիականությունը</u>

Վերջին երկու տասնամյակների րնթազքում ֆոտոնիկայում ւայն ուսումնասիրության առարկա են դարձել շշնջագող մոդերով (ՇՄ) օպտիկական միկրոռեզոնատորները, որոնք իրենցից ներկայազնում են գյանային կամ գնդային համաչափությամբ դիէլեկտրիկ կառուցվածքներ։ Այս համակարգերը ավանդական ռեզոնատորներից առանձնանում են շատ մեծ բարորակություններով ($10^7 - 10^{10}$ կարգի) և օպտիկական այլ բաղադրիչների հետ ինտեգրման հնարավորությամբ, ինչը թույլ է տալիս դրանզ հիման վրա նախագծել տարատեսակ օպտիկական սարքեր, ինչպես օրինակ սենսորներ, լազերներ, ֆիլտրեր, փոխանջատիչներ, ինչպես նաև մոդուլլատորներ՝ էլեկտրամագնիսական ալիքների արդյունավետ ղեկավարման համար [1,2]։ Շշնջացող մոդերով ռեզոնատորներին (ՇՄՌ) առնչվող գլխավոր հարզերից է դրանց գրգռումը, որի իրականազման ամենակիրառական եղանակներն են բարակեզված մանրաթելի և ինտեգրված ալիքատարի միջոցով գրգռումը [1], որոնց դեպքում այիքատար-ռեզոնատոր կապը իրականանում է ալիքատարի էվանեսզենտ դաշտի միջոցով։ Ալլ մեթոդները, օրինակ՝ պրիզմալով կամ այսպես կոչված ազատ տարածությամբ կապը ավելի թիչ արդյունավետ են։ Ընդհանուր դեպքում, արդյունավետ կապի իրականազման գլխավոր խնդիրը հանգում է կապի տիրույթի չափին, ինչպես նաև ռեզոնատորի և այիքատարի մակերևութային անհարթություններին, որոնք զրումների պատճառ են դառնում։ Մլուս կողմիզ՝ ռեցոնատորների չափերի փոքրացումը, որով կապահովվեն ինտեգրման մեծ խտություններ, և միևնույն ժամանակ մեծ բարորակության պահպանումը պահանջում է մեծ բեկման ցուցիչով նլութերի օգտագործում, որը բարդազնում է՝ դրանց հետ աշխատանքը։ Այս համատեքստում բարակ մետաղական թաղանթների օգտագործումը ռեզոնատորի հետ կապի ապահովման համար կարող էլեկտրամագնիսական F էապես մեծազնել ալիքների կառավարման արդյունավետությունը։ Առաջին գլխում դիտարկել կիսագլանային ենք միկրոռեզոնատորում շշնջազող մոդերի գրգռումը հարթ էլեկտրամագնիսական ալիքով, որի կապը ռեզոնատորի հետ իրականանում է բարակ մետաղական գլխում նույն կառուզվածքով ռեզոնատորի թաղանթի uppngnd: Երկրորդ հատկությունները ուսումնասիրված են այիքատարով գրգռման պարագայում, որը ռեզոնատորից բաժանված է բարակ մետաղական թաղանթով։

Ուսումնասիրության արդիական ոլորտ է նաև էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանման ղեկավարումը։ Սա կարելի է իրականացնել մետանյութային կլանիչների միջոցով, որոնք ունակ են կլանել որոշակի սպեկտրի գրեթե ամբողջ էներգիան [3]։ Ըստ կլանման բնութագրերի՝ կլանիչները բաժանվում են երեք տիպի․ միաշերտ (նեղշերտ), բազմաշերտ կամ լայնաշերտ, որոնք լայն կիրառություն են գտել արդի օպտիկական տեխնոլոգիաներում որպես սենսորներ, գրանցիչներ, օպտիկական բուֆերներ և քողարկման տարրեր [3,4]։ Ինտեգրալային տեխնոլոգիաներում կլանիչների արդյունավետ ներդրումը պահանջում է դրանց չափերի փոքրացում, ինչը կբերի ինտեգրման մեծ խտությունների, ինչպես նաև պարզ կառուցվածքների օգտագործում։ <ետևաբար, կոմպակտ չափերով կլանիչների նախագծումն ու դրանց հատկությունների բացահայտումը ունի առաջնային կարևորություն [5]։

Ավանդաբար մետանյութային կլանիչները մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ բաղադրիչներով մեծաչափ պարբերական համակարգեր են, որոնցում միավոր բջջի վերին մակերևույթի մետաղը ունի որոշակի կանոնավոր կառուցվածք [5]։ Կլանիչների մի այլ դաս են որոշակի մակերևույթի վրա անկանոն բաշխված, մինչև մի քանի հարյուր նանոմետր չափերով մասնիկներից կազմված համակարգերը, որոնց պատրաստումը չի պահանջում էլեկտրոնային կամ կենտրոնացված իոնային փնջերով խածատման կիրառություն[3]։

<հմնվելով վերոնշյալ կլանիչների կարևորության վրա, երրորդ գլխի առաջին մասում դիտարկվել է լայնաշերտ կլանմամբ պարզ և միևնույն ժամանակ արդյունավետ մետանյութային կառուցվածք։ Երկրորդ մասում տեսականորեն և համակարգչային մոդելավորման միջոցով հետազոտվել են բարակ մետաղական թաղանթով պատված գնդաձև և գլանաձև դիէլեկտրիկական կառուցվածքեր՝ որպես արդյունավետ կյանիչների հիմնարար տարրեր։

<u>Ատենախոսության նպատակը</u>

Ատենախոսության հիմնական նպատակն է շշնջացող մոդերի առկայությամբ բացահայտել լույսի արագընթաց կառավարման առավել բարենպաստ պայմանները հարթ ալիքատարին կապակցված կիսագլանային միկրոռեզոնատորում։

Պարզել ինֆրակարմիր տիրույթում քողարկող շերտերի տարրեր հանդիսացող բարակ հաղորդիչ թաղանթներով պատված գնդային, գլանային կամ հարթ դիէլեկտրիկներից կազմված կառուցվածքների կլանիչ հատկություննեը։

<u>Գիտական նորույթը</u>

 Յույց է տրվել, որ մետաղապատ հիմքով կիսագլանային դիէլեկտրիկական միկրոռեզոնատորը, համատեղելով Ֆաբրի-Պերոյի և շշնջացող մոդերով միկրոռեզոնատորի հատկությունները, մեծ բարորակության և արտաքին ազդակների նկատմամբ խիստ զգայունության շնորհիվ, կարող է վերահսկելիորեն կառավարել լուսային ալիքը։

- 2. Առաջարկվել ալիքատարի հետ ինտեգրված կիսագյանային ۲, միկրոռեզոնատորի նոր կառուցվածք, որում ալիքատարային մոդի և կիսագյանի շշնջացող մոդերի միջև կապը իրականանում է այիքատարը և կիսագյանը բաժանող բարակ մետաղական թաղանթի միջոցով։ Հարթ այիքատարի և կիսագյանային միկրոռեզոնատորի միջև կառավարեյի կապի ստեղծումը ինարավորություն է տալիս կառուցվածքը ինտեգրալային օպտիկայի ոլորտում օգտագործել որպես մոդուլլատոր։
- 3. Մոդելավորման միջոցով ցույց են տրվել նիկելից ուղղանկյունաձև նանոանտենաներից, սիլիկոնե մեկուսիչից և վոլֆրամե անդրադարձուցչից կազմված մետանյութային կառուցվածքի արդյունավետ լայնաշերտ կլանման հատկությունները միջին և երկարալիքային ինֆրակարմիր սպեկտրներում:
- 4. Յույց է տրվել, որ մետաղական բարակ թաղանթով պատված դիէլեկտրիկական գնդային և գլանային կառուցվածքներում հանդես է գալիս կոնֆիգուրացիոն ռեզոնանսի երևույթը, երբ կառուցվածքի երկրաչափական չափերի և նյութերի դիէլեկտրիկական թափանցելիությունների որոշակի համադրումը ապահովում է ինֆրակարմիր ճառագայթման արդյունավետ կլանում։

<u>Գործնական արժեքը</u>

Ատենախոսության առաջին և երկրորդ գլուխներում ներկայացված գրգռող դաշտի հետ բարակ մետաղական թաղանթի միջոցով կապված շշնջացող մոդերով կիսագլանային միկրոռեզոնատորի հիման վրա կարելի է ստեղծել էլեկտրամագնիսական ալիքների ինտենսիվության արդյունավետ մոդուլյատորներ, որոնք հանդիսանում են ինտեգրալային ֆոտոնիկայի կարևոր բաղադրամասերից, ինչպես նաև տակդիրի վրա ինտեգրված սենսորներ։

Մետանյութային կանոնավոր կառուզվածքով և միկրոմասնիկների վրա հիմնված կյանիչները ունեն կիրառությունների լալն շրջանակ։ Կախված մետանլութալին կառուզվածքի մակերևուլթի մետաղի ընտրությունից, ինարավոր է ստանալ բազմաշերտ կամ լայնաշերտ կյանման բնութագրեր, որոնց շնորհիվ այդ համակարգերը կարող են օգտագործվել որպես սենսորներ, գրանզիչներ, օպտիկական բուֆերներ, կոդավորման տարրեր և այլն։ Մյուս կողմիզ, բարակ մետաղե շերտով պատված միկրոկառուցվածքների կյանման արդյունավետության, այն է՝ կյանման և երկրաչափական կտրվածքների հարաբերության, մեկիզ մեծ լինելը թույլ է տալիս ստեղծել ինֆրակարմիր սպեկտրի արդյունավետ կյանիչներ, որոնցում վերոնշլալ միկրոկառուզվածքները կունենան կամալական բաշխվածություն։ Վերջին փաստը թուլլ է տալիս կիրառել այս միկրոկառուցվածքները քողարկող համակարգերում, ինչպես նաև որպես սենսորներ և էներգիայի արդյունավետ փոխակերպման տարրեր։

<u> Պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթներ</u>

- Բարակ մետաղապատ հիմքով 3մկմ շառավղով կիսագլանային դիէլեկտրիկական ռեզոնատորում ձևավորվող շշնջացող մոդերի բարորակությունը կարող է հասնել 2·10⁴-ի՝ նրա հիմքից ճառագայթի մղման պայմաններում։
- Ինտեգրալային օպտիկայի տարր հանդիսացող և հարթ ալիքատարի հետ վերահսկելիորեն կապված կիսագլանային միկրոռեզոնատորը ապահովում է ճառագայթման արագընթաց մոդուլումը նյութի բեկման ցուցիչի 10⁻⁴ կարգի փոփոխության դեպքում։
- Ուղղանկյուն նանոանտենաներից կազմված մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ կառուցվածքով մետանյութային կլանիչի միջոցով իրականացվում է 3.5 – 8.3 մկմ սպեկտրի արդյունավետ կլանում, որի կլանման հարաբերական շերտը ~81% է, իսկ միավոր բջջի չափերը էապես փոքր են կլանման սպեկտրի կենտրոնական ալիքի երկարությունից։
- 4. Ինֆրակարմիր ճառագայթման արդյունավետ, լայնաշերտ կլանումը կարող է իրականանալ ընկնող ալիքի երկարությունից զգալիորեն փոքր չափերով, համեմատաբար ցածր հաղորդականությամբ բարակ մետաղական թաղանթով պատված գնդաձև և գլանաձև դիէլեկտրական մասնիկների համակարգում։

<u>Աշխատանքի ներկայացումը</u>

Ատենախոսության հիմնական արդյունքները զեկուցվել են Երևանի պետական համալսարանի Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ամբիոնի, Հայ-Ռուսական համալսարանի սեմինարներում, Nanoplasmonics and Applications (Yerevan, Armenia 2018) և Molecular Plasmonics (Leibniz Institute of Photonics Technology, Jena, Germany 2019) գիտաժողովներում:

<u> Հրապարակումները</u>

Ատենախոսության թեմայով տպագրվել է 5 գիտական աշխատանք, որոնցից 4 հոդված գրախոսվող ամսագրերում եւ 1 թեզիս, որոնք ներկայացված են սեղմագրի վերջում։

<u>Ատենախոսության կառուցվածքը</u>

Ատենախոսությունը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից, 130 անուն գրականության ցանկից։ Ատենախոսության ընդհանուր ծավալը 122 էջ է, որում առկա են 33 նկար և մեկ աղյուսակ։

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներածությունում ներկայացված է աշխատանքի արդիականությունը, ձևակերպված են նպատակներն ու խնդիրները, պաշտպանության ներկայացվող հիմնական դրույթները, աշխատանքի գիտական նորույթն ու գործնական արժեքը։

Առաջին գլխում անդրադարձել ենք հարթ ալիքի միջոցով կիսագլանային կառուցվածքով շշնջացող մոդերով միկրոռեզոնատորի գրգռման և մոդային բաշխվածության առանձնահատկություններին, բարորակության արժեքներին և դրա միջոցով էլեկտրամագնիսական ալիքի կառավարման հնարավորությանը։

1.1 պարագրաֆում ընդհանուր անդրադարձ է կատարվել շշնջացող մոդերով օպտիկական միկրոռեզոնատորներին։

1.2 պարագրաֆում ներկայացրել ենք ռեզոնատորների բոլոր հիմնական բնութագրերը։

1.3 պարագրաֆում նկարագրված են շշնջացող մոդերով միկրոռեզոնատորների հիմնական կառուցվածքները, դրանց բնութագրերը, մոդային բաշխվածության առանձնահատկությունները և կիրառության ոլորտները։

1.4 պարագրաֆում քննարկվել են շշնջացող մոդերով միկրոռեզոնատորների գրգռման իիմնական մեթոդները։

1.5 պարագրաֆում ուսումնասիրվել են բարակ մետաղական թաղանթով պատված հիմքով և մեծ բեկման ցուցիչով կիսագլանային կառուցվածքով համակարգում շշնջազող մոդերի առանձնահատկությունները։

Կիսագլանի ներսում և դրանից դուրս դաշտերը նկարագրվում են հետևյալ արտահայտությունների միջոցով [6].

$$E_{z}(\varphi, r, t) = AJ_{m}(k_{s}r) \cdot \sin(m\varphi) \cdot \exp(i\omega t), \qquad (1)$$

$$E_{z}(\varphi, r, t) = BH_{m}^{(1)}(k_{e}r) \cdot \sin(m\varphi) \cdot \exp(i\omega t).$$
⁽²⁾

Այստեղ $J_m(k_s r)$ և $H_m^{(1)}(k_e r)$ -ը համապատասխանաբար Բեսսելի և Հանկելի առաջին սեռի և *m*-րդ կարգի ֆունկցիաներն են։ Վերջինս որոշվում է տվյալ շշնջացող մոդի ազիմուտալ քվանտային թվով։ A-ն և B-ն հաստատուններ են, $k_{\rm s,e} = \sqrt{\varepsilon_{\rm s,e}} \omega/c = 2\pi/\lambda_{\rm s,e}$ ռեզոնատորի ներսում (դրանից դուրս) ալիքային թիվն է, $\lambda_{\rm s,e} = \lambda_0/\sqrt{\varepsilon_{\rm s,e}}$ -ը՝ ալիքի երկարությունը։ Ընդունելով, որ մետաղական շերտի մակերևույթին էլեկտրական դաշտի տանգենցիալ բաղադրիչը հավասար է զրոյի, կիսագլանի և միջավայրի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունների համար ունենալով $\varepsilon_s \gg \varepsilon_e$ առնչությունը և Բեսսելի ու Հանկելի ֆունկցիաների համար օգտագործելով որոշակի մոտավորություններ, (1) և (2) հավասարումներից կիսագլանի ներսի A և դրսի B հաստատունների համար կունենանք հետևյալ առնչությունը.

$$B \approx iA_{\sqrt{\frac{\pi m^{\sqrt{3}}}{2^{\sqrt{3}}}}} \frac{1}{3^{2/3} \Gamma(2/3)} \left(\frac{e}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_e}{\varepsilon_s}}\right)^m,$$
(3)

որտեղ $m \approx 2\pi R/\lambda_s$:

(3) հավասարումից հետևում է, որ |B|/|A| հարաբերության կախումը կիսագլանի *R* շառավղից էքսպոնենցիալ մարող ֆունկցիա է։ Քանի որ ռեզոնատորի ճառագայթային բարորակությունը համեմատական է |A|²/|B|² հարաբերությանը, ապա (3) հավասարումից հնարավոր է որոշել ռեզոնանսային այնպիսի պայմաններ, որոնց դեպքում կիսագլանի կոր մակերևույթից ճառագայթային կորուստները արհամարհելի են և ռեզոնատորի բարորակությունը պայմանավորված է հիմքից ճառագայթմամբ և Ag-ում ջոուլյան կորուստներով։

Կիսագլանի հիմքի մետաղական շերտի վրա ընկնող հարթ ալիքի միջոցով ՇՄերի գրգոման հնարավորությունը ցույց տալու համար իրականացվել են թվային հաշվարկներ՝ հիմնված ՎՏՄ-ի վրա։ Որպես տակդիր՝ ընտրվել է $\epsilon_d = 2.25$ նյութ։ Մետաղական շերտի, կիսագլանի և շրջապատի համար ընտրվել են համապատասխանաբար արծաթ (Ag), գալիումի արսենիդ (GaAs) և օդ ($\epsilon_e = 1$)։ Կիսագլանի շառավիղը՝ R = 3 մկմ, մետաղի հաստությունը՝ h = 80 նմ։

Ռեցոնատորում մեծ բարորակություններով $\lambda_0 \approx 1045.05$ նմ – TM(33,7), $\lambda_0 \approx$ 1051.8 μd – TM(39,5) μ $\lambda_0 \approx$ 1012.98 μd – TM(59,1) մոդերի ռեզոնանսային կորերը, բարորակությունները և E_{z} -բաղադրիչների բաշխվածությունները պատկերված են նկ. (a-c)-ทเบ์: Ռեզոնատորի բա**րո**րակությ**ուն**ր գնահատվել $\xi \quad Q \sim \lambda_0 / \delta \lambda$ 1 արտահայտության միջոզով, որտեղ λ_0 -ն ռեզոնանսային այիքի երկարությունն է, իսկ $\delta\lambda$ -μ' πեզոնանսային կորի յայնությունը։ Ըստ այդմ, TM(33,7), TM(39,5) և TM(59,1) մոդերի բարորակությունները գնահատվել են համապատասխանաբար 25759, 26367 և 24205։ III-V խմբի կիսաիաղորդիչները (որոնցից է GaAs-ը) առանձնանում են յավ արտահայտված էլեկտրաօպտիկական հատկություններով, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել լույսի արդյունավետ կառավարում։ Մլուս կողմից՝ ՇՄՌ-ները յայն կիրառություն են գտել որպես կենսաչափումների սարքեր, որոնց միջոցով իրականացվում է տարբեր նյութերի և չափերի նանոմասնիկների դետեկտում։ Համակարգի այսպիսի հատկությունները ուսումնասիրելու համար նկ. 2-ում պատկերված են կիսագլանի ներսում դաշտի նորմավորված ամպլիտուդի մոդուլի քառակուսու կախումը կիսագլանի բեկման ցուցիչի (ներքևի առանցք) և շառավղի (վերևի առանցք) փոփոխությունից ֆունդամենտալ TM(59,1) մոդի դեպքում։



Նկ. 1: Մեծ բարորակություններով որոշ մոդերի ռեզոնանսային կորերը, մոդալ թվերը, բարորակությունները և *Ez*-բաղադրիչի բաշխվածությունները. (a) TM(33,7), $\lambda_0 \approx 1045.05$ նմ, $Q \approx 25759$, (b) TM(39,5), $\lambda_0 \approx 1051.8$ նմ, $Q \approx 26367$ և (c) TM(59,1), $\lambda_0 \approx 1012.98$ նմ, $Q \approx 24205$.



Նկ. 2։ Ռեզոնատորի ներսում դաշտի էներգիայի կախումը կիսագլանի բեկման ցուցիչի (ներքևի առանցք) և շառավղի (վերևի առանցք) փոփոխությունից ֆունդամենտալ TM(59,1) մոդի դեպքում։ Ռեզոնատորի շառավիղը՝ *R*=3 մկմ, *n*_{GaAs}(λ₀=1012.98 նմ) = 3.4992:

Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ռեզոնատորի ներսում կուտակված էներգիան էապես կախված է ինչպես կիսագլանի բեկման ցուցիչից, այնպես էլ դրա շառավղից։ Այսպես, կիսագլանի բեկման ցուցիչի նույնիսկ 10-4 կարգի փոփոխությունը բերում է ռեզոնատորում կուտակված էներգիայի՝ մոտ կիսով չափ նվազման։ Այս փաստը բացում է լայն հնարավորություններ՝ օգտագործելու ռեզոնատորը լույսի կառավարման համար ոչգծային և էլեկտրաօպտիկական երևույթների միջոցով։ Համանման խիստ կախում առկա է նաև կիսագլանի շառավղի փոփոխությունից։ Այս դեպքում ռեզոնատորի ներսում էներգիան կիսով չափ նվազում է նույնիսկ շառավղի 0.1 նմ փոփոխությունից, ինչը պայմանավորված է ռեզոնանսային հաճախության շեղմամբ։

1.6 պարագրաֆում ամփոփվել են առաջին գլխի հիմնական արդյունքները, ռեզոնատորի առանցքային բնութագրերը, կիրառման ոլորտները։

Երկրորդ գլխում ուսումնասիրվել են ալիքատարի հետ ինտեգրված շշնջացող մոդերով կիսագլանային միկրոռեզոնատորի հատկությունները։

2.1 պարագրաֆում անդրադարձ է կատարվել ինտեգրալային ֆոտոնիկային, դրա հիմնական ֆիզիկական բաղադրիչներին, ինչպես նաև այս ոլորտում շշնջացող մոդերով միկրոռեզոնատորների կիրառություններին։

2.2 պարագրաֆում քննարկվել է ինտեգրված համակարգերում կապի ռեժիմները, ալիքատար-ռեզոնատոր կապի տեսակները և դրանց բնութագրերը։

2.3 պարագրաֆում ուսումնասիրվել է հարթ թիթեղներով ալիքատար – կիսագյանալին միկրոռեզոնատոր ինտեգրված համակարգ։ Ալիքատարի համեմատ մեծ բեկման զուզիչ ունեզող նլութը որպես կիսագյան օգտագործելով՝ ռեզոնատորի են մինչև վակուումում աշխատանքային չափերը փոթրազվել williph երկարությունների կարգը, ինչը կարող է ապահովել մեծ ինտեգրման խտություններ։ Համակարգը բաղկազած է դիէլեկտրիկ ուղղանկլուն ալիքատարից, որը վերևից և ներքևիզ սահմանափակված է մի քանի տասնյակ նանոմետը հաստությամբ մետաղական շերտերով։ Վերևի մետաղական թաղանթի վրա կառուցված է ալիքատարի համեմատ ավելի մեծ բեկման ցուցիչով նլութով կիսագլանալին տեսքով ռեզոնատորը։

Մոտ-ինֆրակարմիր սպեկտրում 500 նմ լայնությամբ SiO₂-ից միամոդ ուղղանկյուն ալիքատարից, 50 նմ Ag-ի շերտից, 3 մկմ շառավղով InP-ից կիսագլանից քաղկացած և օդով շրջապատված ($n_e =1$) համակարգի անցման (սև գծեր) և անդարադարձման (կարմիր գծեր) գործակիցները TE և TM ալիքների դեպքում ցույց են տրված նկ. 3 (a)-ի համապատասխանաբար վերևի և ներքևի գրաֆիկներում։ Անցման սպեկտրում անկումները (մինիմումները), ինչպես նաև անդրադարձման սպեկտրում անկումները), որոնք առաջացել են ալիքատարային մոդի՝ ռեզոնատորի հետ կապի հետևանքով, համապատասխանում են InP-ից կիսագլանի ռեզոնանսներին։ Գրաֆիկներում TE և TM մոդերի (ℓ, m) ինդեքսները ներկայացնում են կիսագլանում ձևավորվող շշնջացող մոդերի շառավղային ℓ և ազիմուտալ m քվանտային թվերը։

Նկ. 3 (a)-ում ցույց են տրված երեք տիպի TE և TM մոդեր՝ $\ell = 1, 2$ և 3 շառավղային մոդային կարգերով։ Ֆունդամենտալ TE(1,56) և TM(1,55) մոդերի անցման և անդրադարձման սպեկտրները, դաշտերի բաշխվածությունները և բարորակությունները պատկերված են նկ. 3-ի համապատասխանաբար (b) և (c) մասերում։ TE(1,56) մոդի անցման կորի լայնությունը՝ $\delta \lambda = 0.0467$ նմ, իսկ TM(1,55) մոդինը՝ $\delta \lambda = 0.109$ նմ։ Ռեզոնատորի բարորակությունը գնահատվել է՝ համաձայն



Եկ. 3: (a) Ուսումնասիրվող համակարգի անցման (սև գծեր) և անդրադարձման (կարմիր գծեր) սպեկտրները 3 մկմ շառավղով InP-ից միկրոռեզոնատորի համար TE (վերևի գրաֆիկ) և TM (ներքևի գրաֆիկ) ալիքների դեպքում։ Նույնը (b) TE(1,56) և (c) TM(1,55) մոդերի համար համապատասխան մոդային բաշխվածություններով և բարորակություններով։ (b) և (c)-ում սլաքներով նշված են ռեզոնանսային կորի լայնությունը և δλ-ի համապատասխան արժեքները։

 $Q \sim \lambda_n / \delta \lambda$ բանաձևի՝ ռեզոնանսային ալիքի երկարության և կորի լայնության միջոցով։ Այսպիսով, 3 մկմ շառավղով InP-ից կիսագյանային միկրոռեզոնատորի TE(1,56) և TM(1,55) ֆունդամենտալ շշնջագող մոդերի բարորակությունները գնահատվել են համապատասխանաբար $-2.14 \cdot 10^4$ և $-9.27 \cdot 10^3$: Այսպիսի միկրոռեզոնատորի՝ կառուզվածքով որպես ինտենսիվության ปกทุกเมนเททก օգտագործելու հնարավորությունը ցույց տալու համար նկ. 4-ում ցույց է տրված TE(1,56), TE(2,50) ալիքատարի ելքում TM(1,55) մոդերի անզման ինտենսիվությունների կախումը կիսագյանի բեկման զուզիչի փոփոխությունիզ իամապատասխանաբար 1009.31 նմ, 1017.43 նմ և 1010.42 նմ ռեզոնանսային այիքի երկարությունների դեպքում։ Նշենք, որ InP-ի բեկման ցուցիչը 1010 նմ ալիքի երկարության շրջակայքում մոտավորապես 3.31 է։ Երևում է, որ անցած ալիքի ինտենսիվությունը ինարավոր է կառավարել՝ փոխելով կիսագլանի նյութի բեկման ցուցիչը 10⁻⁴ կարգով, ինչը իրականանալի է էլեկտրաօպտիկական արտահայտված հատկություններով նյութերի՝ օրինակ III-V խմբի կիսահաղորդիչների միջոցով։



Նկ. 4։ Ալիքատարի ելքում ТЕ(1,56), ТЕ(2,50) ТМ(1,55) մոդերի անցման ինտենսիվութ յունների կախումը կիսագլանի բեկման ցուցիչի փոփոխությունից համապատասխանաբար 1009.31 նմ, 1017.43 նմ և 1010.42 նմ ռեզոնանսային ալիքի երկարությունների դեպքում։

Մոդուլյատորը կարող է պատրաստվել՝ այսպես կոչված կիսահաղորդչային միկրոոսպնյակների պատրաստման տեխնոլոգիայի միջոցով կամ կիսահաղորդչային աստիճանաձև բուրգի՝ քիմիական անիզոտրոպ խատածման եղանակով ցանկալի կիսագլանային տեսքը ստանալով։

2.5 պարագրաֆում ամփոփվել են այս գլխում ստացված արդյունքները և կիսագլան-ալիքատար համակարգի առանցքային հատկությունները։

Երրորդ գլուխը նվիրված է ինֆրակարմիր սպեկտրի էլեկտրամագնիսական ալիքների կլանիչների երկու տարատեսակի, որոնցից առաջինը հիմնված է մետանյութային, իսկ երկրորդը՝ միջուկ-կաղապար կառուցվածքով միկրոչափական մասնիկների վրա։

3.1 պարագրաֆում, որպես ներածություն, ներկայացված են ինֆրակարմիր սպեկտրի կլանիչներ, որոնք պայմանականորեն բաժանել ենք երկու մասի։ Առաջին խմբում ներառված են մետանյութային կլանիչները, որոնք կազմված են կանոնավոր կառուցվածքով միավոր բջիջներից։ Երկրորդ խմբում ներկայացված են որոշակի մակերևույթի վրա անկանոն բաշխված նանոմասնիկներից կազմված կլանիչները։

3.2 պարագրաֆում նկարագրված են նիկելի վրա հիմնված լայնաշերտ մետանյութային կառուցվածքի կլանող հատկությունները միջին և երկարալիքային ինֆրակարմիր տիրույթում։ Ուսումնասիրվող կլանիչը հիմնված է մետաղդիէլեկտրիկ-մետաղ կառուցվածքի վրա, որի եռաչափ սխեմատիկ տեսքը և մակերևույթի կառուցվածքը պատկերված են նկ. 5 (a)-ում։ *p*-ն պարբերականությունն է, *L*₁-ը և *L*₂-ը համապատասխանաբար ներքին և արտաքին օղակների կողերի երկարություններն են, *w*-ն՝ կողի լայնությունը, իսկ *g*-ն՝ երկու հարևան կողերի միջև հեռավորությունը։ Տակդիրի հաստությունը *t*_m է, դիէլեկտրիկինը՝ *t*, և մետաղական կառուցվածքի ուսումնասիրության համար օգտագործվել է վերջավոր տարրերի մեթոդը։ Քանի որ մետաղական տակդիրի հաստությունը գործնականում բացակայում է, և կառուցվածքի կլանումը կարելի է հաշվել

$$A(\lambda) = 1 - R(\lambda) \tag{4}$$

բանաձևով, որտեղ $R(\lambda) = |S_{11}|^2$ -ը ալիքի երկարությունից կախված անդրադարձման գործակիցն է՝ արտահայտված ցրման *S*-պարամետրի միջոցով։

Ամբողջ վերլուծության ընթագքում կյանումը կհամարենք արդյունավետ, եթե այն մեծ է կամ հավասար 0.8-ի։ Կառուցվածքի կյանման շերտի հարաբերական լայնությունը սահմանվում է $RBW = 2 \cdot (\lambda_1 - \lambda_s) / (\lambda_1 + \lambda_s) = BW / \lambda_c$, որտեղ λ_1 -ը և λ_s -ը 80%-hg մեծ կլանման 2pրտի վերին և ստորին սահմաններն են, BW= $\lambda_r - \lambda_s - t$ կյանման շերտի բացարձակ լայնությունը, իսկ λ_e -ն՝ դրա կենտրոնական ալիքի երկարությունը։ Մոդելավորման ընթացքում օգտագործված երկրաչափական պարամետրերն են. $t_m = 100$ նմ, $t_s = 300$ նմ, p = 1 մկմ, $L_1 = 400$ նմ, $L_2 = 650$ նմ, w = 10075 μմ, g = 20 μմ μ h = 30 μմ։ Որպես տակդիր, դիէլեկտրիկ և նանոանտենաների մետաղ օգտագործվել են վոլֆրամ, սիլիզիում և նիկել։ Այս պարամետրերի դեպքում միայն արտաքին և միայն ներքին քառակուսաձև օղակներ պարունակող համակարգերի՝ մակերևույթին ուղղահայաց ընկնող էլեկտրամագնիսական դաշտի կյանման սպեկտրները ցույց են տրված նկ. 5 (b)-ում՝ համապատասխանաբար օղակաձև և շրջանաձև սիմվոլներով։ Այն դեպքում, երբ 3 – 10 մկմ սպեկտրում փոքր օղակը պարունակող կառուցվածքը ցույց է տայիս հարաբերականորեն լայնաշերտ կյանում՝ BW ~ 2.14 մկմ կյանման շերտով 3.73 մկմ- 5.87 մկմ տիրույթում, ինչը իամապատասխանում է RBW ~ 45 % իարաբերական կյանման շերտին, մեծ օրակով

կլանիչը ունի կլանման երկու ռեզոնանսներ՝ 4.11 մկմ և 7.78 մկմ ալիքի երկարություններով և կլանման 0.97 և 0.89 բացարձակ արժեքներով։



Նկ. 5: (a) Մետանյութային կլանիչի եռաչափ պատկերը և վերին մակերևույթի կառուցվածքը։ (b-c) Համակարգի կլանման սպեկտրը մակերևույթի միայն ներքին (շրջաններ) և միայն արտաքին (օղակներ) քառակուսաձև օղակներով և երկու քառակուսաձև օղակներով կառուցվածքի դեպքում։

Φննարկված երկու քառակուսաձև օղակներով համակարգի կլանման սպեկտրը պատկերված է նկ. 5 (c)-ում։ Այստեղ էֆեկտիվ կլանումը (80 % և ավելի) տեղի ունի 3.52– 8.32 մկմ ալիքի երկարությունների տիրությում՝ ~4.8 մկմ կլանման շերտի լայնությամբ, ինչը համապատասխանում է RBW ~ 81 % հարաբեարական կլանման շերտի լայնությանը (սպեկտրի կենտրոնական ալիքի երկարությունը $λ_c$ ~ 5.92 մկմ է)։ Կլանման շերտում երեք ռեզոնանսներ են նկատելի՝ $λ_1$ = 3.8 մկմ, $λ_2$ = 5.6 մկմ և $λ_3$ = 7.78 մկմ ալիքի երկարություններով և կլանման համապատասխանաբար ~ 0.95, 0.88 և 0.91 արժեքներով։ Այստեղ լայնաշերտ կլանումը պայմանավորված է նանոանտենաների՝ փոքր բարորակություններով դիպոլային մոդերի գրգոմամբ, որոնք Ni-ի՝ մեծ կորուստներով օպտիկական հատկությունների արդյունք են։ Համակարգի կլանման հատկությունները անկախ են ընկնող ալիքի անկման անկյունից՝ մինչև 65° TM-բևեռացած ալիքների դեպքում և մինչև 40° TE-բևեռացած ալիքների դեպքում։ Աղյուսակ 1.1-ում ներկայացված է առաջարկվող կլանիչի երկարաչափական և կլանման բնութագրերի համեմատությունը միջին և երկարալիքային ինֆրակարմիր տիրույթների այլ կլանիչների հետ [7–10]։

կլանիչ՝	ների հետ։					
<ຖາເນ່	≥ 80% կլանման տիրույթ (մկմ)	Կլանման շերտ		Միավոր բջջի չափեր		Շեո
		BW (մկմ)	RBW (%)	Բացարձակ (մկմ³)	,Հ,−ին հարաբերական	տեր
[7]	3.2 – 4.4	1.2	31.6	0.35 × 2 × 2	$0.09\times0.53\times0.53$	3
[8]	8 – 12	4	40	1.44 × 2 (2D)	0.14 × 0.25	3
[9]	4 - 6.6	2.6	49	0.68 × 8 × 8	0.12 × 1.5 × 1.5	3
[10]	7.7 – 12.2	4.5	45	0.79 × 6.76 × 6.76	0.08 × 0.68 × 0.68	3
	5.2 – 13.7	8.5	90	$1.56 \times 9.2 \times 9.2$	$0.16\times0.92\times0.92$	5
Առա- ջարկվող կլանիչը	3.52 - 8.32	4.8	81	0.43 × 1 × 1	0.07 × 0.17 × 0.17	3

Աղ․ 1։ Առաջարկվող կլանիչի կառուցվածքային և կլանման բնութագրերի համեմատությունը որոշ այլ՝ միջին և երկարալիքային ինֆարակարմիր տիրույթի կլանիչների հետ։

Ինչպես հետևում է համեմատությունից, Ni-ի վրա հիմնված կլանիչի բնութագրերը մրցունակ են գրականության մեջ հանդիպող այլ կլանիչների բնութագրերի հետ։ Ավելին՝ ~ 4.8 մկմ լայնությամբ կլանման շերտ հնարավոր է եղել ապահովել միավոր բջջի շատ փոքր չափերի միջոցով 0.07*λ*_c × 0.17*λ*_c × 0.17*λ*_c.

3.3 պարագրաֆում ուսումնասիրվել են երկարալիքային ինֆրակարմիր սպեկտրում ($\lambda - 4 - 12$ մկմ) նանոմետրական չափերի գնդաձև և գլանային միջուկկաղապար կառուցվածքների կլանման հատկությունները էլեկտրաստատիկ մոտավորության սահմաններում։ Միջուկի, կաղապարի և շրջակա միջավայրի դիէլեկտրիկ թափանցելիությունները նշանակվել են համապատասխանաբար ϵ_1, ϵ_2 և ϵ_3 -ով : Միջուկի շառավիղը R_1 է, իսկ թաղանթի հաստությունը՝ $h = R_2 - R_1$, որտեղ R_2 ը ամբողջ համակարգի շառավիղն է։ Էլեկտրաստատիկ մոտավորության սահմաններում ընդունվել է, որ $R_2 \ll \lambda$, որտեղ λ -ն համակարգը շրջապատող միջավայրում ալիքի երկարությունն է։ Անալիտիկ վերլուծության արդյունքում գնդաձև և գլանաձև միջուկ-կաղապար կառուցվածքների կլանման կտրվածքների համար ստացվել են հետևյալ բանաձևերը [11].

$$\sigma_{\rm abs}^{\rm sph} = \frac{8\pi^2}{\lambda} R_2^3 \frac{18(1-\eta)\varepsilon_3\varepsilon_{2i}}{\left[3(\varepsilon_1+2\varepsilon_3)+2(1-\eta)\varepsilon_{2r}\right]^2+4(1-\eta)^2\varepsilon_{2i}^2},$$
(5)

$$\sigma_{\rm abs}^{\rm cyl} = \frac{8\pi^2 L}{\lambda} R_2^2 \frac{4(1-\zeta)\varepsilon_3\varepsilon_{2i}}{\left\lceil 2\left(\varepsilon_1 + \varepsilon_3\right) + \left(1-\zeta\right)\varepsilon_{2r} \right\rceil^2 + \left(1-\zeta\right)^2\varepsilon_{2i}^2},\tag{6}$$

երը

(7)

(8)

ալիքի

$$\sigma_{\rm abs}^{\rm cyl} = \frac{6\pi L}{\lambda} R_2^2 \frac{4(1-\zeta)\varepsilon_3 \varepsilon_{2j}}{\left[2(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) + (1-\zeta)\varepsilon_{2r}\right]^2 + (1-\zeta)^2 \varepsilon_{2j}^2},$$

npmbų $\eta = R_1^3/R_2^3$ u $\zeta = R_1^2/R_2^2$, $\varepsilon_{2j} \sim |\varepsilon_{2r}| \gg \varepsilon_1 + 2\varepsilon_3$: Uju upmuhujmnijaniúutaj

^{abs}
$$\lambda = \frac{1}{2} \left[2 \left(\varepsilon_1 + \varepsilon_3 \right) + \left(1 - \zeta \right) \varepsilon_{2r} \right]^2 + \left(1 - \zeta \right)^2 \varepsilon_{2i}^2$$

$$\mathbb{L} \zeta = \frac{R_1^2}{R_2^2}, \quad \varepsilon_{2i} \sim \left| \varepsilon_{2r} \right| \gg \varepsilon_1 + 2\varepsilon_3 : \text{Uju uprouhujunnipjniu}$$

որտեղ
$$\eta = R_1^3/R_2^3$$
և $\zeta = R_1^2/R_2^2$, $arepsilon_{2i} \sim \left|arepsilon_{2r}
ight| \gg arepsilon_1 + 2arepsilon_3$ ։ Այս արտահայտությո
իրենց առավելագույն արժեքին են հասնում համապատասխանաբար

 $(1-\eta) = \frac{3(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_3)}{2|\varepsilon_2|} \ll 1 \ \ln(1-\zeta) = \frac{2(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)}{|\varepsilon_2|} \ll 1.$

Կյանման հակտությունները հարաբերականորեն բնութագրելու համար ներմուծել ենք, այսպես կոչված, կյանման և ցրման արդյունավետությունները հետևյալ կերպ․

 $Q_{\rm abs} = \frac{\sigma_{\rm abs}}{S} \sqcup Q_{\rm scat} = \frac{\sigma_{\rm scat}}{S}.$

Բարակ մետաղական թաղանթով պատված գնդաձև և գյանաձև դիէլեկտրիկ կառուզվածքների եռաչափ մոդելավորումը իրականացվել է ՎՏՄ-ի վրա հիմնված COMSOL Multiphysics ծրագրի միջոցով։ 5 նմ (սև, օղեր), 10 նմ (կապույտ, եռանկյուններ) և 15 նմ (կարմիր, քառակուսիներ) հաստություններով տիտանե թաղանթով պատված դիէլեկտրիկ միջուկով գնդաձև և գլանաձև կառուզվածքների

երկարությունից ցույց է տրված համապատասխանաբար նկ. 3.11-ի (a) և (b)-ում։ Գծերը ներկայացնում են տեսական, իսկ սիմվոլները՝ մոդելավորման միջոցով ստազված արդյունքները։ Կարելի է նկատել, որ երկու կառուզվածքների դեպքում

Օդում գտնվող ենթաալիքալին չափերի համասեռ մասնիկների (դրանք

վակուումում

րնկնող

ռաշտի

որտեղ Տ-ը համապատասխան կառուցվածքի լայնական կտրվածքի մակերեսն է`

կախումը

տեսական և մոդելավորման արդյունքները մեծապես համընկնում են։

պայմանների դեպքում։

կյանման

 $S_{\rm soh} = \pi R^2$ գնդի և $S_{\rm cyl} = 2R_2 L$ գլանի համար։

էֆեկտիվության

բնութագրվում են ε դիէլեկտրիկ թափանցելիությամբ) կյանման հատկությունների ուսումնասիրությունը զույզ է տալիս, որ արդյունավետ կյանումը տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ - դրա դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը մոտ է մեկին (11)։ Խնդիրը հանգամանորեն քննարկելու համար փոխարինենք առավել մետաղական թաղանթով պատված դիէլեկտրիկ գունդը, որի միջուկի և թաղանթի դիէլեկտրիկ թափանցելիություններն են εլ և εշ, համարժեք համասեռ գնդով այնպես, որ դրա շառավիղը հավասար լինի միջուկ-կաղապար կառուցվածքի ընդհանուր R2 Նշանակենք իամասեռ գնդի արդյունավետ շառավղին։ դիէլեկտրիկ թափանցելիությունը \mathcal{E}_{eff}^{sph} -ով:



Եկ. 6: Տիտանե թաղանթով պատված (a) գնդաձև և (b) գլանաձև դիէլեկտրիկ միջուկով կառուցվածքների կլանման էֆեկտիվության տեսական (գծեր) և մոդելավորման միջոցով ստացված (սիմվոլներ) սպեկտրները թաղանթի 5 նմ (սև, օղեր), 10 նմ (կապույտ, եռանկյուններ) և 15 նմ (կարմիր, քառակուսիներ) հաստությունների համար։ Երկու կառուցվածքների դեպքում *R*₁ = 500 նմ, *ε*₁ = 2.25, *ε*₃ = 1: Ներդիրները ցույց են տալիս կառուցվածքները և ընկնող հարթ ալիքի բնութագրերը։

Քվազիստատիկ մոտավորության սահմաններում՝ գնդաձև և գլանաձև միջուկկաղապար կառուցվածքին համարժեք գնդի արդյունավետ դիէլեկտրիկ թափանցելիությունները կարելի է ստանալ խառնուրդների համար Մաքսվել-Գարնետի տեսության հիման վրա հետևյալ կերպ [12].

$$\varepsilon_{\text{eff}}^{\text{sph}} = \varepsilon_2 \frac{(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2) + 2\eta(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{(\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2) - \eta(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)},\tag{9}$$

$$\varepsilon_{\text{eff}}^{\text{cyl}} = \varepsilon_2 \frac{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + \zeta(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)}{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) - \zeta(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)},\tag{10}$$

npտեղ $\eta = R_1^3/R_2^3$ և $\zeta = R_1^2/R_2^2$: Կաղապարը 5 նմ հաստությամբ Ti է, մյուս պարամետրերը նույնն են, ինչ նկ. 6-ում։ Ti-ի դիէլեկտրիկ թափանցելիության իրական և կեղծ մասերը զույց են տրված նկ. 7 (a)-ում. Միջուկ-կաղապար համակարգի և համարժեք արդյունավետ գնդի սխեմատիկ պատկերը զույզ է տրված նկ. 7 (b)-ում։ Միջուկ-կաղապար կառուզվածքներին համարժեք գնդի և գյանի արդյունավետ դիէլեկտրիկ թափանցելիությունները, հաշվարկված համապատասխանաբար (9) և (10)բանաձևերով, պատկերված են նկ. 7 (c)-ում կապուլտ և կարմիր գծերով։ Յույզ տալու համար միջուկ-կարապար կառուզվածքների և ռոանզ համարժեք արդյունավետ մասնիկների կյանման L զրման հատկությունների իամապատասխանությունը, իրականացվել են թվային

հաշվարկներ R = 505 նմ շառավղով գնդաձև և գլանաձև համասեռ մասնիկների համար՝ որպես դիէլեկտրիկ թափանցելիության տվյալներ օգտագործելով նկ. 7 (c)ում բերված արժեքները։ Արդյունքները ներկայացված են նկ. 7 (d) և (e)-ում։



 Նկ. 7: (a) Ti-ի դիէլեկտրիկ փաթանցելիությունը (Ordal et al. 1998): (b) Միջուկկաղապար համակարգի և համարժեք արդյունավետ գնդի սխեմատիկ պատկերը: (c) Ti-ից թաղանթով միջուկ-կաղապար կառուցվածքների արդյունավետ դիէլեկտրիկ թափանցելիությունների իրական (հոծ գծեր) և կեղծ (կետագծեր) մասերը։ Կառուցվածքների պարամետրերն են. ε₁ = 2.25, R₁ = 500 նմ և R₂ = 505 նմ։ (d, e) Միջուկ-կաղապար գնդաձև և գլանաձև կառուցվածքների (գծեր) և դրանց համարժեք արդյունավետ համասեռ կառուցվածքների (սիմվոլներ) կլանման և ցրման արդյունավետությունները։

Շնորհիվ հանաչափության մեծ կարգերի, կլանումը ամբողջական (գունդ) կամ մասնակի (գլան) անկախ է անկման անկյունից կամ բևեռացումից։ Կառուցվածքները կարելի է օգտագործել խառնուրդներում որպես կառուցվածքային տարրեր, ըստ որում չկա դրանց կանոնավոր դասավորության անհրաժեշտություն։

ԵՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մետաղապատ հիմքով կիսագլանային դիէլեկտրիկական միկրոռեզոնատորը, համատեղելով Ֆաբրի-Պերոյի և շշնջացող մոդերով միկրոռեզոնատորի հատկությունները, մեծ բարորակության և արտաքին ազդակների նկատմամբ խիստ զգայունության շնորհիվ, կարող է վերահսկելիորեն կառավարել լուսային ալիքը: Որոշվել են կիսագլանի կոր մակերևույթից ճառագայթային նվազագույն կուրստները ապահովող նյութական ու երկարաչափական պարամետրերի արժեքները։

Ալիքատարի հետ համատեղված կիսագլանային միկրոռեզոնատորում, ուր ալիքատարային մոդի և կիսագլանի շշնջացող մոդերի միջև վերահսկելի կապը իրականանում է ալիքատարը և կիսագլանը բաժանող բարակ մետաղական թաղանթի միջոցով, ելքային լուսային հզորությունը կարող է կտրուկ փոփոխվել՝ կիսագլանի բեկման ցուցչի փոքր փոփոխությամբ (10-4)։ Առաջարկված կառուցվածքի հիման վրա կարելի է նախագծել արագագործ մոդուլյատորներ։

Հարթ W-Si տակդիրի և մակերևույթի՝ Ni-ից ուղղանկյունաձև նանոանտենաներով մետանյոթային կառուցվածքը կարող է ծառայել որպես արդյունավետ լայնաշերտ կլանիչ միջին և երկարալիքային ինֆրակարմիր սպեկտրներում։ Կառուցվածքի կլանման գործակիցը անկախ է ընկնող դաշտի բևեռացումից և անկման անկյունից։

Մետաղական բարակ թաղանթով պատված ենթաալիքային չափերի դիէլեկտրիկական գնդային և գլանային կառուցվածքներում հանդես է գալիս կոնֆիգուրացիոն ռեզոնանսի երևույթը, երբ կառուցվածքի երկրաչափական չափերի և նյութերի դիէլեկտրիկական թափանցելիությունների որոշակի համադրումը ապահովում է ինֆրակարմիր ճառագայթման արդյունավետ կլանում։ Ի տարբերություն ավանդական մետանյութային կլանիչների, այս կառուցվածքների վրա հիմնված կլանիչի պարագայում չկա դրանց կանոնավոր բաշխման անիրաժեշտություն։

Հղված գրականություն

- [1] Matsko, A.B. and Ilchenko, V.S. (2006) Optical resonators with whispering-gallery modespart I: basics. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*. 12 (1), 3–14.
- Ilchenko, V.S. and Matsko, A.B. (2006) Optical resonators with whispering-gallery modespart II: applications. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*. 12 (1), 15– 32.
- [3] Yu, P., Besteiro, L. V., Huang, Y., Wu, J., Fu, L., Tan, H.H., et al. (2019) Broadband Metamaterial Absorbers. *Advanced Optical Materials*. 7 (3), 1800995.
- [4] Cui, Y., He, Y., Jin, Y., Ding, F., Yang, L., Ye, Y., et al. (2014) Plasmonic and metamaterial structures as electromagnetic absorbers. *Laser & Photonics Reviews*. 8 (4), 495–520.

- [5] Ogawa, S. and Kimata, M. (2018) Metal-Insulator-Metal-Based Plasmonic Metamaterial Absorbers at Visible and Infrared Wavelengths: A Review. *Materials*. 11 (3), 458.
- [6] Chiasera, A., Dumeige, Y., Féron, P., Ferrari, M., Jestin, Y., Nunzi Conti, G., et al. (2010) Spherical whispering-gallery-mode microresonators. *Laser & Photonics Reviews*. 4 (3), 457–482.
- [7] Ma, W., Wen, Y., and Yu, X. (2013) Broadband metamaterial absorber at mid-infrared using multiplexed cross resonators. *Optics Express*. 21 (25), 30724.
- [8] Wang, S., Wang, Y., Zhang, S., and Zheng, W. (2017) Mid-infrared broadband absorber of full semiconductor epi-layers. *Physics Letters A*. 381 (16), 1439–1444.
- [9] Dayal, G. and Ramakrishna, S.A. (2014) Broadband infrared metamaterial absorber with visible transparency using ITO as ground plane. *Optics Express.* 22 (12), 15104.
- [10] Guo, W., Liu, Y., and Han, T. (2016) Ultra-broadband infrared metasurface absorber. Optics Express. 24 (18), 20586.
- [11] Landau, L.D., Pitaevskii, L.P., and Lifshitz, E.M. (1984) Electrodynamics of Continuous Media. 2nd ed. ELSEVIER SCIENCE & TECHNOLOGY, Oxford, United Kingdom.
- [12] Chettiar, U.K. and Engheta, N. (2012) Internal homogenization: Effective permittivity of a coated sphere. *Optics Express*. 20 (21), 22976.

Հրատարակված աշխատանքների ցուցակ

<u>Հոդվածներ</u>

- [1] Haroyan, H., <u>Parsamyan, H.</u>, Yezekyan, T., and Nerkararyan, K., (2018), Semicylindrical microresonator: excitation, modal structure, and Q-factor. *Applied Optics*. 57 (22), 6309.
- [2] Parsamyan, H.A., Nerkararyan, K.V., and Bozhevolnyi, S.I., (2019), Efficient broadband infrared absorbers based on core-shell nanostructures. *Journal of the Optical Society of America B*. 36 (10), 2643.
- [3] <u>Parsamyan, H.</u>, Haroyan, H., and Nerkararyan, K., (2020), Light control in a hemicylindrical whispering gallery microcavity-parallel plate waveguide system. *Optics Communications*. 474 126122.
- [4] <u>Parsamyan, H.</u>, (2020), Near-perfect broadband infrared metamaterial absorber utilizing nickel. *Applied Optics*. 59 (25), 7504.

<u>Թեզիսներ</u>

[5] <u>Parsamyan, H.</u>, Haroyan, H., Yezekyan T. and Nerkararyan, K., *Semicylindrical Whispering Gallery Mode Microresonator for Biosensing*, Book of Abstract, Molecular Plasmonics-2019 Conference, Jena, Germany, 2019: p. 45.

ПАРСАМЯН ГЕНРИХ

МОДУЛЯЦИЯ И ПОГЛОЩЕНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В МИКРО И НАНОМЕТРИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СИММЕТРИЕЙ

АННОТАЦИЯ

Микрорезонаторы со сферической или цилиндрической симметрией, где формируются моды шепчущей галереи, отличаются от обычных резонаторов чрезвычайно высокой добротностью и возможностью интегрирования с другими оптическими компонентами. Это позволяет разрабатывать различные оптические устройства, такие как датчики, лазеры, фильтры, переключатели, а также модуляторы для эффективного управления светом.

Поглотители электромагнитных волн характеризуются эффективным поглощением излучения, когда волновая энергия преобразуется в омические потери или другие формы энергии, так что в результате взаимодействия волны с поглотителем не происходит значительного пропускания или отражения. Наиболее распространенные поглотители основаны на метаматериалах, представляющих собой специально разработанные структуры сконструираванные из субволновых элементарных ячеек.

Основной целью диссертации явлаяется выявление наиболее благоприятных условий управления светом в полуцилиндрическом микрорезонаторе, связанным с плоским волноводом, в условиях формирования мод шепчущей галереи. Изучение поглощающих свойств покрытых тоньким проводящим слоем диэлектрических структур сферической или цилиндрической формы, в инфракрасной области спектра.

Было показано, что система, состоящая из полуцилиндрического диэлектрического микрорезонатора, плоская поверхность которой покрыта тонким металлическим слоем, благодаря высокой добротности и крайней чувствительности к внешним воздействиям позволяет эффективно контролировать свет. Такая структура сочетает в себе свойства как резонаторов Фабри-Перо, так и резонаторов моды шепчущей галереи. Добротность мод шепчущей галереи, формируемых в диэлектрическом резонаторе радиусом 3 мкм, может достигать 2 · 10⁴, при накачке с основания системы плоской электромагнитной волной.

Предложена новая структура полуцилиндрического микрорезонатора, связанного с прямоугольным волноводом, где связь между волноводными модами и модами шепчущей галереи полуцилиндра осуществляется через тонкий металлический слой между ними. Управляемая связь между волноводом и полуцилиндром открывает возможности использования структуры в качестве модулятора в интегральной оптике, где возможна быстрая модуляция света за счет изменений порядка 10⁻⁴ показателя преломления полуцилиндра.

Исследована метаповерхностная структура для широкополосного поглощения инфракрасного излучения. Метаматериал состоит из вольфрамового отражателя, кремниевой подложки и прямоугольных никелевых наноантенн в качестве верхней структуры. Оценки показывают, что при использовании такой метаповерхности может быть достигнуто примерно идеальное поглощение в диапазоне 3.52-8.32 мкм электромагнитного спектра, когда размеры элементарной ячейки намного меньше рабочих длин волн.

Показано, что в покрытым тонким слабо проводящим металическим слоем сферических и цилиндрических диэлектрических структурах, возникает эффект конфигурационного резонанса, когда в результате определенного сочетания геометрических параметров и диэлектрических проницаемостей структурных элементов, обеспечивается условие эффективного поглощения инфракрасного излучения. Для достижения эффективного поглощения в качестве слабо проводящих металлов можно использовать никель, титан или хром. Сечения поглощения таких конфигураций превышают значения геометрических сечений, в то же время имеют пренебрежимо малое рассеяние. Из-за высоких степеней симметрии структур поглощение нечувствительно к поляризации и угла падения волны. На основе предложенных структур можно создать достаточно тонкие маскирующие слои.

PARSAMYAN HENRIK

MODULATION AND ABSORPTION OF THE INFRARED RADIATION IN MICRO AND NANOSTRUCTURES WITH CYLINDRICAL SYMMETRY

ANNOTATION

Whispering gallery microcavities, which are dielectric structures with spherical or cylindrical symmetry, differ from conventional resonators in their extremely high Q-factor and the ability to be integrated with other optical components. This allows one to design various optical devices, such as sensors, lasers, filters, switches, as well as modulators for efficient light control.

Electromagnetic wave absorbers are structures characterized by efficient radiation absorption at operating wavelengths, with the electromagnetic energy being transformed into ohmic heat or other forms of energy, so that no sizeable transmission or reflection is produced as a result of wave interaction with an absorber. The most common absorbers are based on metamaterials representing specially designed arrays of subwavelength unit cells.

The main purpose of the thesis is to reveal the most favourable conditions of the light control in the presence of the whispering gallery modes in the semicylindrical microresonator coupled with a flat waveguide. To explore the infrared absorption properties of the spherical, cylindrical and flat dielectric structures covered by thin conducting layers, which can serve as basic elements for cloaking.

It was shown that due to high Q-factor and extreme sensitivity from the external stimuli a system composed of a semicylindrical dielectric microresonator with a flat surface covered by a thin metal layer allows for superintending control of the light. Such a system combines the properties of both Fabry-Perot and whispering gallery mode resonators. The Q-factor of the whispering gallery modes of the 3- μ m-radius dielectric resonator can reach up to $2 \cdot 10^4$ in case of the pumping from the base of the system by a plane wave.

A new structure of a semicylindrical microresonator integrated with a rectangular waveguide was suggested. The coupling between waveguide modes and whispering gallery modes of the semicylinder is performed via a thin metal layer between them. The controllable coupling between the waveguide and semicylinder opens up possibilities of using the structure as a modulator in integrated optics. Here the fast modulation of the light is possible by changing the semicylinder refractive index in the order of 10^{-4} .

Efficient broadband infrared absorption properties of a metamaterial structure composed of tungsten reflector, silicon spacer and rectangular nickel nanoantennas as a top pattern were explored by using numerical simulations. Evaluations show that by using a metasurface consisting of such unit cells high absorption in the 3.52-8.32 µm range of the electromagnetic spectrum can be achieved when the unit cell dimensions are much smaller than the operating wavelengths.

It was demonstrated that the effect of the configuration resonance in spherical and cylindrical dielectric configurations covered by thin layers of poorly conducting metals appears.

Here the configuration resonance resulting in efficient absorption of the infrared radiation is conditioned by a special combination of the geometrical parameters and dielectric permittivities of the structural components. As poorly conducting metals, nickel, titanium and chromium can be used. The absorption cross-sections of such configurations exceed the geometrical ones and at the same time, proceeding a negligible scattering. Due to high degrees of symmetry, the absorption of configurations is highly insensitive to the incident field polarization and angle. The latter allows one to design very thin cloaking layers composed of such structures.

Ally 11/mpun